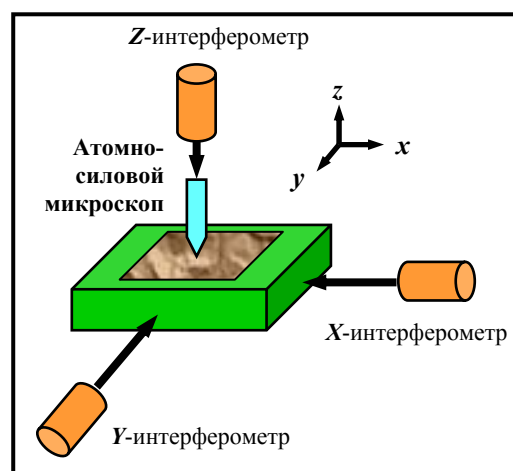


**Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ
СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И ВАКУУМА
(НИЦПВ)**

**Эталонная 3D лазерная интерферометрическая
система измерений наноперемещений**

Область применения

Эталонная система на основе атомно-силового микроскопа оригинальной конструкции и лазерных интерферометрических измерителей наноперемещений предназначена для измерения нанорельефа поверхности и линейных перемещений по 3-м координатам в микроэлектронике, нанотехнологии и микромеханике, аттестации мер и стандартных образцов для калибровки растровых электронных и сканирующих зондовых микроскопов.



Основные технические характеристики

Измерение наноперемещений	по X, Y, Z-координатам
Дискретность по X и Y:	0,1 нм
Диапазон измерений линейных перемещений:	
по X и Y:	1 ÷ 3000 нм
по Z:	1 ÷ 1000 нм
Погрешность измерений:	
по X и Y:	0,5 нм
по Z:	0,5 ÷ 3 нм

119421, Москва,
ул. Новаторов, д. 40, корп. 1
НИЦПВ
Телефон: (007-095) 935-97-77
Тел./факс: (007-095) 935-96-90
E-mail: fgupnicpv@mail.ru